

21st Century COE, Nanoelectronics for Tera-bit Information Processing

Hiroshima University

第4回広島国際ワークショップ 「テラビット情報ナノエレクトロニクス」

— 超微細デバイス·プロセス技術 —

日時: 平成17年9月16日(金)

場所:広島大学学士会館

プログラム講演題目

9:00-9:10 開会の辞

9:10-9:30 牟田泰三学長挨拶

9:30-9:50 COE成果報告 広島大学 岩田穆

9:50-10:30 招待講演 慶応大学 黒田忠広 _____「システムLSI: 挑戦と好機」

0:30-11:10 招待講演 エール大学 T. P. Ma

「将来のCMOS技術のためのHigh-kゲート絶縁膜」

11:10-11:50 招待講演 カリフォルニア大学LA校 J. C. S. Woo

「サブ20nm新規Siベーストランジスタ」

11:50-13:10

13:10-13:50 招

招待講演 IMEC S. Biesemans

「サブ45nm技術のためのスケーリング技術」

13:50-14:30 招待講演 ソウル大学 Y. J. Park

「ナノMOSFETとスケーリング問題のデバイスシミュ

レーション」

14:30-15:10 招待講演 STマイクロエレクトロニクス F. Boeuf

「45nmノードのための従来型バルクデバイスおよび

バルク+アーキテクチャ技術」

15:10-15:20 休 憩

15:20-16:00 招待講演 松下電器 丹羽正昭

「HfベースのPVD High-kゲートスタックの現状 ―

プロセス改良による駆動電流の向上」

16:00-16:40 広島大学 角南英夫ほか4名

「COEにおけるデバイス・プロセス研究開発の現状」

16:40-18:00 一般発表(ポスター)

18:00 バンケット

主催:広島大学

後援:IEEE広島支部、応用物理学会中国四国支部、

電気通信情報学会中国支部



広島大学ナノデバイス・システム研究センター スーパークリーンルーム (0.1μm, クラス10)

問会##

広島大学ナノデバイス・システム研究センター COE事務員 白石絵美

Tel: 082-424-6969 / Fax: 082-424-6969 E-mail: shiraishi@sxsys.hiroshima-u.ac.jp http://www.rcis.hiroshima-u.ac.jp/21coe/